DIN EN 62496-2-2:2011-09 (D)

Optische Leiterplatten - Teil 2-2: Messungen - Abmessungen optischer Leiterplatten (IEC 62496-2-2:2011); Deutsche Fassung EN 62496-2-2:2011

Inhalt

Seite

Vorwort 2
1 Anwendungsbereich 5
2 Normative Verweisungen 5
3 Begriffe 5
4 Messbedingungen 5
5 Messobjekt und Messverfahren 5
6 Messverfahren 6
6.1 Kernform 6
6.1.1 Messeinrichtung 6
6.1.2 Durchführung 8
6.2 Koordinaten von E/A-Anschlüssen 8
6.2.1 Messverfahren für OCB mit E/A-Kantenanschluss 8
6.2.2 Messverfahren für OCB mit E/A-Flächenanschluss 10
6.3 Äußere Form der optischen Leiterplatte 12
6.3.1 Verfahren 1 (Referenzverfahren) – Anwendung des Untersuchungssystems 12
6.3.2 Verfahren 2 (alternatives Verfahren) – Anwendung der Maßzeichnung 13
6.4 Versatzwinkel von E/A-Anschlüssen 14
6.4.1 Untersuchung des Querschnitts 14
6.5 Spiegelwinkel 18
6.5.1 Verfahren 1 (Referenzverfahren) – Anwendung des Untersuchungssystems 18
6.5.2 Verfahren 2 (alternatives Verfahren) – Anwendung eines konfokalen Mikroskops 19
6.6 Bohrung 20
6.6.1 Verfahren 1 (Referenzverfahren) – Anwendung des Untersuchungssystems 20
6.6.2 Verfahren 2 (alternatives Verfahren) – Anwendung der Laserabtastung 20
Anhang A (informativ) Rasterabstand der Struktur 22
Literaturhinweise 25
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen 26

Bilder

Bild 1 – Beispiel für eine Messeinrichtung für die Untersuchung der Kernform 7
Bild 2 – Beispiel für den Prüfaufbau für die Untersuchung der Kernform (OCB mit E/A-Kantenanschlüssen oder abgeschnittener Prüfling) 7
Bild 3 – Beispiel für den Prüfaufbau mit einem Halogen-Lampenkopf mit Lichtwellenleiter für die Untersuchung der Kernform (OCB mit E/A-Flächenanschlüssen) 7

Bild 4 – Beispiel für ein Justiersystem für die optische Lage für OCB mit E/A-Kantenanschlüssen 9
Bild 5 – Beispiel für ein Justiersystem für die optische Lage für OCB mit E/A-Flächenanschlüssen 11
Bild 6 – Beispiel für die Vergleichsprüfung mit einer Maßzeichnung für eine flexible OCB mit Fasern 14
Bild 7 – Versatzwinkel der E/A-Anschlüsse in OCB mit E/A-Kantenanschluss 15
Bild 8 – Versatzwinkel der E/A-Anschlüsse in OCB mit E/A-Flächenanschluss 15
Bild 9 – Parameter für den Versatzwinkel in OCB mit E/A-Kantenanschluss 16
Bild 10 – Parameter für den Versatzwinkel in OCB mit E/A-Flächenanschluss 16
Bild 11 – Schematischer Aufbau für die Messung des Spiegelwinkels mit einem konfokalen Mikroskop 19
Bild 12 – Beispiel des mit einem konfokalen Mikroskop ermittelten Profils an einem Spiegel 20
Bild A.1 – Rasterabstand der Struktur und Messobjekte (Beispiel für eine einlagige Leiterplatte) 22
Bild A.2 – Rasterabstand der Struktur und Messobjekte (Beispiel für eine mehrlagige Leiterplatte) 23

Tabellen

Tabelle 1 – Messobjekte und zugehörige Messverfahren 6